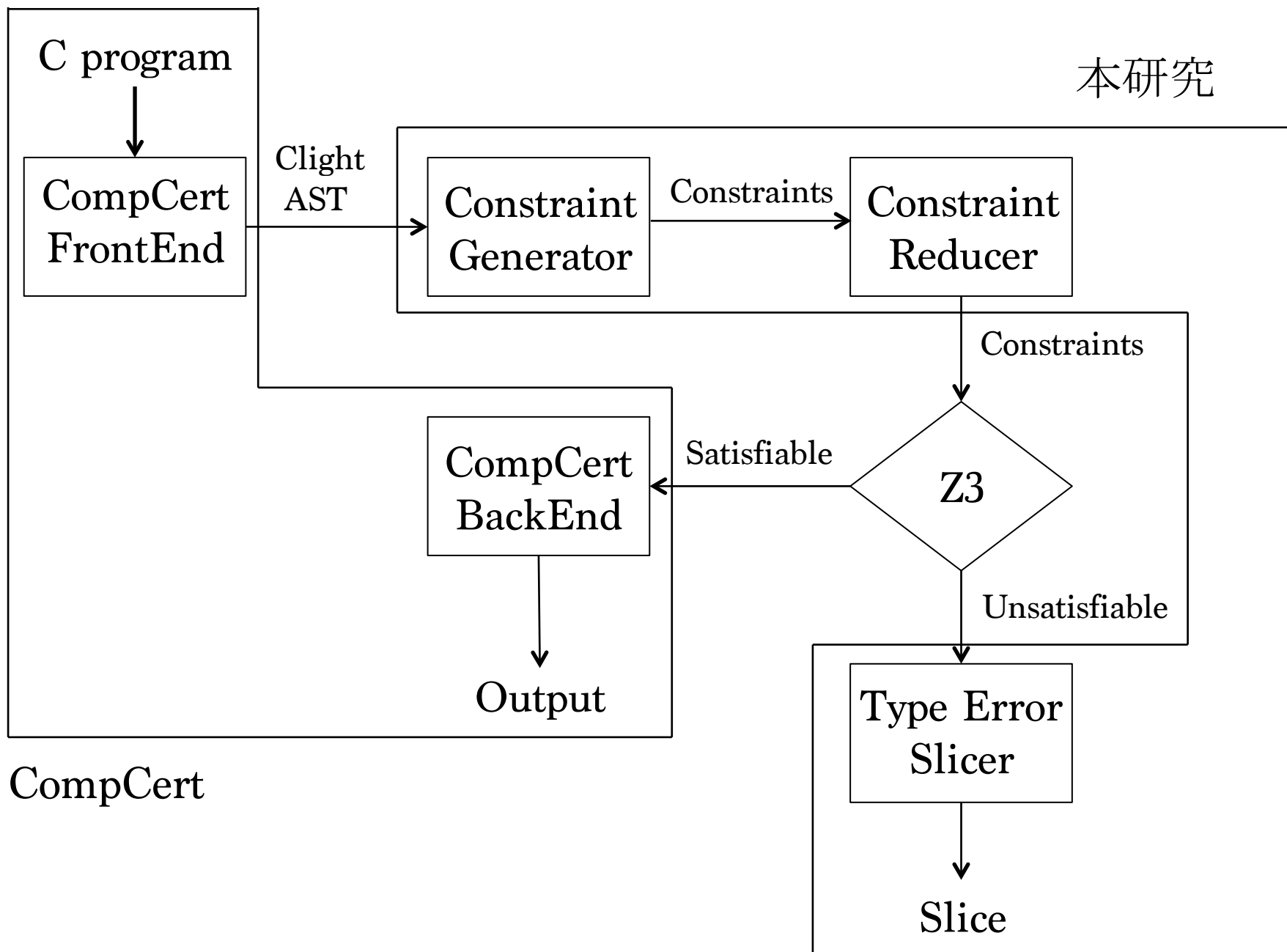


本研究



CompCert